



ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Δρ Κ.Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑ
SPM SCANNING PROBE MICROSCOPY & AFM ATOMIC FORCE MICROSCOPE
VEECO
Πέμπτη 10 Μαΐου 2007

Η Εταιρεία VEECO – πρωτοπόρος στη Μετρολογία – συνεχίζει να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και νέων εφαρμογών. Στα πλαίσια αυτά η Εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Veeco, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει την Πέμπτη 10 Μαΐου 2007 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Ιδρύματος «ΟΡΜΥΛΙΑ» ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ που βρίσκεται στα Ορμύλια Χαλκιδικής για τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της **Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (SPM) & Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης (AFM)**.

Οι ομιλίες θα δοθούν από τον ειδικό επιστήμονα Dr. Hartmut Stadler. Θα υπάρχει εγκατεστημένο όργανο AFM (Model NanoScope SP / MultiMode) το οποίο θα επιδειχθεί κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.

09.30-10.00 *Προσέλευση – Καφές- Αναψυκτικά*

10:00-10:10 Welcome to the Seminar

Δ. Σταμέλος

10.10-10:30 Veeco Introduction

Dr. H. Stadler

10:30-11:30 Nanoscale Characterization Techniques

Dr. H. Stadler

11:30-11.45 *Διάλειμμα - Καφές - Αναψυκτικά*

11:45-12:45 Advance in SPM Instrumentation

Dr. H. Stadler

12:45-13:15 *Ελαφρύ γεύμα*

13:15-14:30 SPM/AFM Application

Dr. H. Stadler

14:30-16:30 Workshop with NanoScope 3D/Multimode & Questions

Dr. H. Stadler

Θα δοθεί *Βεβαίωση Συμμετοχής* σε όσους παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Μετρολογίας VEECO.

Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι το αργότερο Παρασκευή 4 Μαΐου 2007, στην κα Ράνια Γεωργίου, τηλ. 210 6748 973 ή fax 210 6748 978, ή e-mail r.georgiou@analytical.gr

Με εκτίμηση,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Δ. Σταμέλος
Χημικός
Δ/ντής Πωλήσεων Veeco